



『 JPCA Show 2025 』 出展のご案内

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。

当社は来る 2025 年 6 月 4 日（水）～ 2025 年 6 月 6 日（金）に東京ビッグサイトに開催される『電子機器トータルソリューション展』へ出展する運びとなりました。

本展では「IC 開発ターンキーサービス」「信頼性評価・調査解析の受託サービス」をメインソリューションとして展示を予定しております。

当社のターンキーサービスはアナログ IC から小規模ロジックを含めたミックスド・シグナル IC の開発まで幅広くカバーしており、新規 IC 開発、モジュールの IC 化、EOL 対応など 大手半導体メーカーが対応しない少量多品種生産のカスタム IC（アナログ ASIC）開発を実現いたします。

また その他、設計・PKG・信頼性評価・解析などの工程ごとの受託、スポットでの対応もご説明させていただきます。

つきましては、ご多用中のところ恐縮ではございますが、当社ブースにお越し頂き、製品・技術・サービスをご高覧賜りたく、ご案内申し上げます。

当日は過去の実績も合わせて紹介を予定しておりますので、ご来場を心よりお待ちしております。

敬具

会 期 : 2025 年 6 月 4 日（水）～ 2025 年 6 月 6 日（金）

会 場 : 東京ビッグサイト 東 7 ホール

ブース番号 : 7D-06

【ブース位置】 東京ビッグサイト 東展示棟 7 ホール



来場者登録はこちら



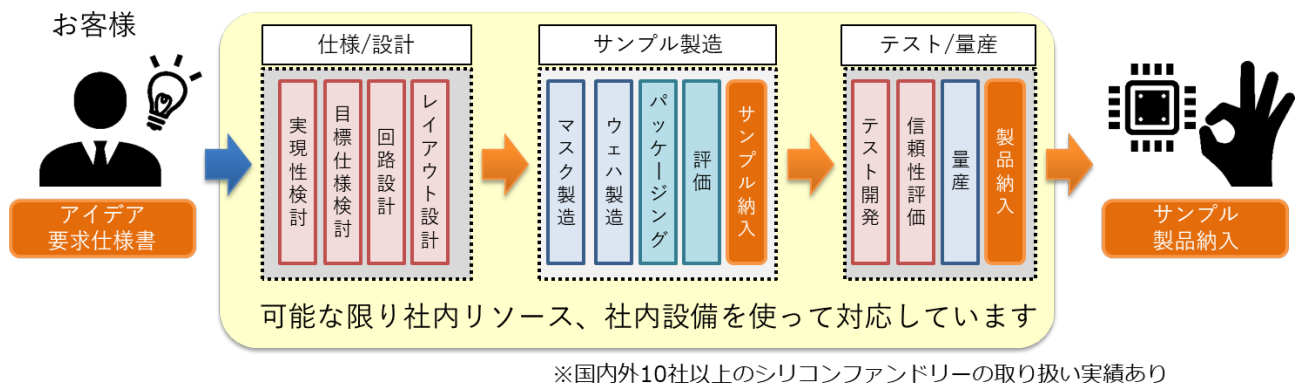
e-Analog
内藤電誠工業株
東 7 ホール 7D-06



裏面 【出展製品・サービス 一例】を紹介

● IC 開発ターンキーサービス

カスタム IC をご検討のお客様に、少量多品種の IC、LSI のターンキーサービスを提供しています。複数の国内外ファウンドリを使用できることから、お客様のご要求に最適なプロセスを提案いたします。ご要求数量やご予算に応じて MPW (Multi Project Wafer)、MLM (Multi Layer Mask)、フルマスクといった製造方法が選択でき、試作から量産対応まで承っております。



●信頼性評価・調査解析の受託サービス



各種信頼性試験・調査解析の受託サービスでお客様の品質向上をサポートいたします。

- ・信頼性評価/環境試験
各種環境試験、連続モニタ、リフロー耐熱性試験、リポール、染色評価、熱抵抗測定
- ・物理解析/断面解析
顕微鏡観察、X線 CT 観察、SAT 観察、PKG 開封、SEM/EDX、断面加工
レーザー開封、ボンダブル・シェア強度試験、PIND 試験

他にも多数の製品や保有技術、サービスの紹介を用意してお待ちしております。

内藤雷誠工業株

LSI 設計事業部 設計営業部

Tel. 044-431-7130 Fax. 044-431-7138

E-mail ml.ndkj.e-analog@ndk-grp.jp

URL <https://www.lsi.ndk-grp.co.jp/>